

스퍼터링법으로 증착한 Al 박막의 결정 배향성에 관한 연구 (Study on the Crystallographic Orientation of Sputtered Al thin film)

한국과학기술원 : 최한메, 최시경

1. 서론

스퍼터링법으로 증착된 박막은 시편의 수직 방향으로 특정한 결정 배향성을 가진다고 보고되고 있다. 이 경우의 결정 배향성은 박막 증착 변수에 따라 변화하며, 박막의 기계적, 전기적, 광학적 특성에 큰 영향을 미친다. 본 연구에서는 Al 박막을 스퍼터링으로 증착하여 결정 배향성의 원인에 대해서 고찰하였다.

2. 실험 방법

RF 마그네트론 스퍼터링법으로 Al 박막을 Si 기판 위에 증착하였다. 기판은 의도적으로 가열하지 않았으며, 작업압력을 1mTorr로 일정하게하고, 기판에 각각 0V, -30V, -50V, -70V, -100V, -150V, -200V의 바이어스를 가하였다. XRD를 이용하여 증착된 박막의 결정 배향성과 잔류응력을 측정하였다.

3. 실험 결과

기판의 바이어스에 따른 결정 배향성의 변화는 바이어스가 증가함에 따라 (100) 배향성이 커지다가 -50V에서 최대값을 나타내고, 바이어스가 더욱 커지게 되면 (111) 배향성을 나타냈다. 또한 기판의 바이어스에 따른 잔류응력의 변화도 결정 배향성의 변화와 거의 비슷하게, 바이어스가 증가함에 따라 인장응력이 커지다가 -50V에서 최대값을 나타내고, 바이어스가 더욱 커지게 되면 인장응력이 줄어들었다.

박막의 결정 배향성은 표면 에너지와 변형에너지의 합을 최소화하는 방향으로 성장한다. 따라서 잔류 응력이 큰 경우에는 변형에너지를 최소화하기 위해, 변형에너지가 작은 (111) 방향으로, 잔류응력이 작은 경우에는 표면에너지를 최소화하기 위해, 표면 에너지가 작은 (100) 방향으로 성장하게 된다.